有機太陽電池の光伝搬解析と反射防止構造の設計

久保田 繁[†], 鹿又 健作, 籾山 克章, 鈴木 貴彦, 廣瀬 文彦 山形大学 大学院理工学研究科 〒992-8510 山形県米沢市城南 4-3-16

E-mail: †kubota@yz.yamagata-u.ac.jp

あらまし 有機太陽電池の反射防止膜を設計するための実用的な手法を開発した.本設計手法では,あらかじめ 使用に供する材料の種類を指定した場合に,短絡電流を最大にする,各層の材料の組み合わせと膜厚の最適解を見 つけることができる.さらに,膜厚誤差に対するロバスト性や,使用する材料の層数等の生産上の重要な特性を考 慮した,最適に近い解(準最適解)を見つけて,実際的な反射防止膜の検討を行うことも可能である.また,提案 する設計方法と比較するため,材料を限定せずに屈折率の最適化を行った場合の解の特性,及び反射防止膜の基板 に対する相対位置が発電電流に与える影響についても検討を行った.

キーワード 有機太陽電池,反射防止,システム最適化,ロバスト設計法

Optical analysis and design of the anti-reflection coating

for organic solar cells

Shigeru Kubota, Kensaku Kanomata, Katsuaki Momiyama, Takahiko Suzuki, Fumihiko Hirose

Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University,

4-3-16 Jonan, Yonezawa, Yamagata, 992-8510 Japan

Abstract We developed a practical design method for antireflection coatings for organic solar cells. In this analysis, after the user set the layer number and each optical properties of refractive index (n) and extinction coefficient (k), the system automatically offers the optimized solution for the best short circuit current density in the solar cell and quasi-optimized solutions. This analysis allows for the evaluation of effects of thickness deviation for each layer on the power generation performance. We studied, for comparison, the cases where the refractive index of the materials used in antireflection coatings is optimized, and also examined the effects of the position of the antireflection coatings, within the solar cells, on their performance.

Keyword Organic solar cells, Antireflection coating, System optimization, Robust design method

1. はじめに

太陽光発電のコスト削減や,製造プロセスの単純化 を目的として,近年,有機太陽電池の開発が活発に行 われている[1].現状の開発項目は,新規材料や製造プ ロセスに関連する内容が多いが,今後,発電効率をさ らに向上させるために,有機太陽電池に適した反射防 止技術の必要性が高まると予想される[2].

一般的な反射防止技術は、古くから広く研究されて おり、様々な手法が提案されている.従来は、4分の 1波長の膜から構成される多層薄膜を用いる手法が中 心であったが[3]、最近の研究[4,5]により、異なる層間 で屈折率が徐々に変化する graded-refractive-index (GRIN)構造により、広いスペクトル範囲で反射率を低 下できることが報告されている.GRIN 構造を実用化 するには、屈折率を正確に調節した材料を作成するこ とが困難な課題であるが[6]、Sol-gelを用いたアプロ ーチや、nanoporous 材料を用いた方法が提案されてい る[4,5,6]. その他の重要な反射防止技術には,ナノま たはマイクロ構造を太陽電池表面に付加する手法が挙 げられる[2,6]. このような光波長より小さい構造を持 つ材料は,反射防止膜の屈折率を制御するのみでなく, 長波長光の光路長も増加させることで,光を太陽電池 内部に閉じこめて,性能をさらに向上させることがで きる[7].

反射防止構造の光学設計の観点からは、これらの GRIN 及びナノ/マイクロ構造といった近年開発された 手法は、材料の屈折率や表面形状の精密な制御を通じ て、設計の自由度を高める役割を果たすと考えられる. 一方、有機太陽電池の持つ低コスト、単純な製造プロ セスといったシリコン太陽電池に対する優位性[1]を 十分に利用するためには、製造現場で容易に使用可能 なコンベンショナルな材料を選択的に使用し、有機太 陽電池に特に適した安価な反射防止膜を設計する技術 も依然として重要であると考えられる.また、このよ うな実用的な反射防止膜の設計手法に対する要求とし て、製造時の膜厚誤差によって性能が低下する影響を 評価し、それを考慮した設計案を見つけられることが 望ましいであろう.

このような観点から、本研究では、反射防止膜に使 用する材料をあらかじめ限定した場合に、発電により 得られる短絡電流(*Jsc*)の増大を図るための、有機太陽 電池の反射防止構造の設計手法を提案する.提案する 設計手法により、最適解に近い準最適な設計案も同時 に見つけることができ、最大発電効率を若干犠牲にす る代わりに、膜厚誤差に対してよりロバストな設計解 を得ることもできる.また、比較のため、反射防止膜 の屈折率と膜厚を同時に最適化した場合の反射防止構 造や、反射防止膜の基板に対する位置が性能に与える 影響に関しても検討を行う.

2. 提案する設計法

2.1 最適化アルゴリズム

本研究では、発電により得られる短絡電流を増加さ せるように、図1に示すように、P3HT/PCBM型有機 太陽電池の基板前後に多層反射防止膜を設計する問題 を扱う.設計者が、使用可能な材料をあらかじめ指定 した場合に、反射防止膜各層の材料組合せと膜厚を最 適化するため、材料の組合せを変化させる outer loop と、各層の膜厚の最適化を行う inner loop から構成さ れるアルゴリズムを、以下のように構築した.

- STEP 1 (outer loop の開始). 使用できる材料の中から, 全数探索により,反射防止膜の各層の材料の組み合 わせを1つずつ選択する.
- STEP 2 (inner loop の開始). 反射防止膜各層の膜厚の 初期値を一様分布に従って、ランダムに決定.
- STEP 3. STEP 2 で決定した初期値を用いて、準ニュートン法により、J_{sc}を局所的に最大化する反射防止膜の膜厚を探索する.
- STEP 4 (inner loop の終了). (STEP 2,3 で) あらかじめ 規定された回数(50 回)の準ニュートン法による探 索が終了した場合には,探索により得られた解の中 で最良の解を保存して STEP5 に進み,そうでない 場合には STEP 2 に戻る.
- STEP 5 (outer loop の終了). STEP 1 で全材料の組み合わ せが試されていれば, STEP 6 に進む. そうでなけ れば STEP 1 に戻る.
- STEP 6. STEP 4 で保存された全ての解を, J_{sc} の大きさ に従ってソートし,既定個数の上位解(準最適解) について,膜厚誤差を考慮した場合の J_{sc} の低下量 (後述する式1の δJ_{sc})を評価し,結果を出力する.



図1 シミュレーションに用いた有機太陽電池の構造. L1-L6(左)が設計により決定される反射防止膜を表す.

Outer loop (STEP 1-5)では,材料の全組合せが順に 試されるのに対し,inner loop (STEP 2-4)では,outer loop で選択された材料の各組合せに対し,ランダムサ ーチと準ニュートン法を組み合わせた Multistart 法[8] により,各層の膜厚に関する大域的最適解を算出する. 図 1(左)の6層反射防止膜の場合,同じ材料が隣接する 場合を除くと,outer loop で選択される材料の組み合わ せは 144 通り存在し,処理時間を主に決定づける準ニ ュートン法の適用回数は 7,200(=144×50)回となる.こ の場合, Intel Core i7 2.93 GHz の PC を使用して,約 1h の計算時間を要した.

この方法の特徴の1つは、準最適解に対してのみ膜 厚誤差を評価する点である.勿論、評価関数に誤差の 影響を取り込んで最適化を図ることも可能である.し かし、誤差の影響の評価は、多数層の膜厚を独立に変 化させる手順を要するため、評価関数に組み込んだ場 合、反射防止膜の層数の増加と共に、計算コストが急 激に増加する.しかも、準最適解では、膜厚の1次の 変化に対して Jsc の値が停留しており、膜厚誤差に対 する鋭敏性が低いため、誤差の影響の低い解を探すに は、準最適解の膜厚に対する影響を評価すれば、実用 上十分であると考えられる.

上記の方法(STEP1-6)との比較を行うため、反射 防止膜の各層の屈折率と膜厚を、Mulstistart により最 適化する計算も行った.この計算は、屈折率を基本的 に任意に制御できる nanoporous 材料[5]を使用する場 合に相当し、設計の自由度が高いため、より高い性能 の反射防止膜を設計することができる.

2.2 膜厚誤差の影響の評価法

提案した最適化アルゴリズムの STEP6 では,反射防止膜の各層の膜厚が,局所的最適解を与える膜厚値か

ら独立に変動した場合の、 J_{sc} の低下量の期待値 δJ_{sc} を、次式により算出した.

$$\delta \boldsymbol{J}_{SC} = \frac{1}{2^{p}} \sum_{i=1}^{2^{p}} \left[\boldsymbol{J}_{SC}(\boldsymbol{d}^{*}) - \boldsymbol{J}_{SC}(\boldsymbol{d}^{*} + \Delta \boldsymbol{d}^{i}) \right], \quad (1)$$

ここで、**d**^{*}は、局所的な最適解を与える反射防止膜の 各層の膜厚を並べたベクトルであり、その次元は反射 防止膜の全層数 *p* に一致する. Δd^i は、各層の膜厚 のばらつきの方向と大きさを決定するベクトルであり、 本研究を通して、各層毎に独立に、膜厚を±5 nm だけ 変化させるものとする。例えば、*p* = 2 の場合には、 $\Delta d^1 = (5 \text{ nm}, 5 \text{ nm}), \Delta d^2 = (5 \text{ nm}, -5 \text{ nm}), \Delta d^3 = (-5 \text{ nm}, 5 \text{ nm}), \Delta d^4 = (-5 \text{ nm}, -5 \text{ nm}) O ように、 <math>\Delta d^i$ (*i* = 1,...,2²)は一辺の長さが10 nm の長方形の各頂点座標に 対応する. $J_{sc}(d)$ は、反射防止膜の各層の膜厚を並 べた *p* 次元ベクトル **d**に対応した短絡電流の値であり、 $J_{sc}^* \equiv J_{sc}(d^*)$ が STEP 4 で得られた解に対応する.

 $\tilde{J}_{sc} \equiv J_{sc}^* - \delta J_{sc} = \frac{1}{2^p} \sum_{i=1}^{2^p} J_{sc} (\mathbf{d}^* + \Delta \mathbf{d}^i) \varepsilon$, 膜厚誤 差を考慮した場合の短絡電流の評価量として使用する. J_{sc}^0 を反射防止を行わない場合の太陽電池の短絡電流 値とする時, 膜厚誤差が無い状態での得られた解の発 電電流の増加率 $\gamma = (J_{sc}^*/J_{sc}^0 - 1) \times 100 \ (\%) \varepsilon$, 膜厚 を 考 慮 し た 場 合 の 発 電 電 流 の 増 加 率 $\tilde{\gamma} = (\tilde{J}_{sc}/J_{sc}^0 - 1) \times 100 \ (\%) \varepsilon$, 反射防止膜の性能評価 に使用した.

2.3 光伝搬解析による **J**_{SC} の算出

 J_{SC} を算出するため、特性マトリクス法[3]に基づいた光学解析を行った、本研究で検討した反射防止構造

表1 設計により得られた反射防止膜の特性

付の有機太陽電池は、2 つの多層薄膜構造のアセンブ リー(stack)[11]が, stackより非常に厚いガラス基板を 挟む構造を持つ(図1右).そこで、過去の太陽電池の 解析計算[10,11]と同様に、各 stackの内部では coherent な電磁界の加算が行われるのに対し、基板内部では coherence が失われて irradiance の加算が行われるもの と仮定して計算を行った.光学計算の概要を以下にま とめる.

特性マトリクス法では、隣接する層間の interface での、電界と磁界の境界条件を満足するように、Maxwell 方程式の平面波解を重ね合わせた解が代数演算により 得られる.この方法では、各 stack の反射率 R と透過 率T は、

$$R = \left(\frac{\eta_i B - C}{\eta_i B + C}\right) \left(\frac{\eta_i B - C}{\eta_i B + C}\right)^*, \qquad (2)$$
$$T = \frac{\operatorname{Re}(\eta_e)}{2\eta_i} \left(\frac{2\eta_i}{2\eta_i}\right) \left(\frac{2\eta_i}{2\eta_i}\right)^* \qquad (3)$$

$$T = \frac{\operatorname{Re}(\eta_e)}{\operatorname{Re}(\eta_i)} \left(\frac{2\eta_i}{\eta_i B + C} \right) \left(\frac{2\eta_i}{\eta_i B + C} \right), \qquad (3)$$

として与えられる. 但し, $\eta_i \ge \eta_e$ はそれぞれ, stack に入射する側及び stack から出力する側の媒質の optical admittance を表す. B, Cは, layer r の特性マト リクスを M_r とする時,

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = M_1 M_2 \cdots M_q \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_e \end{bmatrix}, \tag{4}$$

$$M_{r} = \begin{bmatrix} \cos \delta_{r} & (i \sin \delta_{r}) / \eta_{r} \\ i \eta_{r} \sin \delta_{r} & \cos \delta_{r} \end{bmatrix},$$
(5)

として求められる.ここで、 δ_r は第 r層の上下端に おける光の位相差、 η_r は第 r層の材料の optical admittance である[3].

No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	γ / γ̃
1	$MgF_{2}(92)$	ZnS (6)	Al ₂ O ₃ (104)	MgF ₂ (144)	Al ₂ O ₃ (135)	$MgF_{2}(35)$	+7.51 / +6.97 %
2	MgF ₂ (81)	Al ₂ O ₃ (120)	—	MgF ₂ (144)	Al ₂ O ₃ (135)	$MgF_{2}(35)$	+7.39 / +7.17 %
3	MgF ₂ (93)	ZnS (7)	Al ₂ O ₃ (101)	Al ₂ O ₃ (195)	ZnS (104)	$MgF_{2}(31)$	+7.26 / +6.59 %
4	$MgF_{2}(75)$	Al ₂ O ₃ (112)	$MgF_{2}(172)$	MgF ₂ (162)	ZnS (106)	$MgF_{2}(33)$	+7.18 / +6.60 %
_	n=1.25 (82)	n=1.05 (12)	_	n=1.08(214)	n=2.19 (118)	n=1.05 (30)	+10.28% / +9.43%

No.i (i=1-4)の解は,設計により得られた i 番目に J_{sc} の大きい解を,最下段の解は屈折率の最適化により 得られた解を示す. No.1-No.4の各行には,各層(L1-L6)で使用する材料名及び膜厚(カッコ内)を, 最下段には,各層の屈折率の値と膜厚(カッコ内)を示す.L3の"-"の記載は、最適計算の結果膜厚が 0となった場合(つまり、5層で十分である場合)を示す。短絡電流の増加率は,左側の数が膜厚誤差の 無い場合(γ),右側の数が膜厚誤差を考慮した場合($\tilde{\gamma}$)に相当する.

2つの stack がそれぞれ単独で存在する場合の反射率, 透過率を求めた後,発電層(第 r_p 層とする)における光 吸収率を,

$$A_{r_p} = I_s(\psi_{r_p-1} - \psi_{r_p}),$$
(6)

$$\psi_r = \frac{\operatorname{Re}(B_r C_r^*)}{\operatorname{Re}(B C^*)},\tag{7}$$

$$\begin{bmatrix} B_r \\ C_r \end{bmatrix} = M_{r+1} M_{r+2} \cdots M_q \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_e \end{bmatrix},$$
(8)

として算出する. 但し, ψ_r は入射面から第 r 層までの subassembly に関する potential transmittance [3, 12]であ る. I_s は, 全入射光の中で, 発電層を含む stack に実 際に入射する irradiance の割合であり, 基板の両面で の繰り返し反射を考慮して,

$$I_s = \frac{T_a T_c}{\psi (1 - R_b R_c)},\tag{9}$$

として求められる. 但し, R_b , R_c , T_a , T_c は図 1 右に図 解する各部の反射率, 透過率であり, ψ は発電層を含 む stack 全体の potential transmittance である.

波長 λ の光の発電層による吸収率を $A_{r_p}(\lambda)$ とする時,発電層が吸収する波長 λ の光子数は,

$$N_{p}(\lambda) = A_{r_{p}}(\lambda)F(\lambda)\frac{\lambda}{hc},$$
(10)

と記述できる. 但し, $F(\lambda)$ は, 波長 λ の太陽光の irradiance であり, AM1.5 の太陽光スペクトルデータを 用いた. hはプランク定数, cは真空中の光速である. 素電荷 q_e を用いて, 光子数を電流に変換して,

$$J_{sc} = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_g} q_e N_p(\lambda) F_{NR}(\lambda) d\lambda , \qquad (11)$$

として,最終的に J_{SC} が得られる[9]. 但し, λ_g は P3HT のバンドギャップに相当する光波長(653 nm), F_{NR} は non-recombination factor であり F_{NR} =1 を仮定した[12].

2.4 FDTD 法

2.3 節の光学計算の妥当性を検証するため, FDTD 法 [13]により,各層の光吸収率を算出し,特性マトリク ス法による結果と比較した.強い吸収性材料において 電磁界が発散するのを防ぐため,Lorentz model [16]に より誘電率を記述した.

FDTD 計算では、分厚いガラス基板の存在が、計算時間を大幅に増加させることが知られている[17]. こ

の問題を改善するため、我々は、第 r 層の波長 λ にお ける吸収率 $A_r(\lambda)$ を、次の関係を利用して算出するこ とを提案する.

$$A_{r}(\lambda) = E_{d_{0}}[\hat{A}_{r}(\lambda;d_{0})]$$

$$= \frac{1}{D} \int_{d_{0,\min}+D}^{d_{0,\min}+D} \hat{A}_{r}(\lambda;d_{0}) dd_{0} \approx \frac{n_{0}}{\lambda} \int_{d_{0,\min}+\lambda/n_{0}}^{d_{0,\min}+\lambda/n_{0}} \hat{A}_{r}(\lambda;d_{0}) dd_{0}$$
(12)

ここで、Dは十分大きな正数、 n_0 は、ガラス基板の屈 折率である. $\hat{A}_r(\lambda;d_0)$ は、基板の厚さを d_0 とした時の (FDTDによって求められる)第r層の吸収率であり、 $E_{d0}[x]$ は d_0 がランダムに変化する際の確率変数xの平 均値を表す. (12)式の最初の等式は、 d_0 が完全にラン ダムに変動する時、ガラス基板は光の位相情報を伝え ることができないため、 $E_{d0}[A_r(\lambda;d_0)]$ の値が、基板が coherence を失った場合の吸収率に一致することを意 味している. (12)式の最右辺に示す、異なる d_0 に対す る FDTD計算の結果を平均化する計算法により、小さ いレンジの d_0 を用いて FDTD計算を行うことができる ため、計算時間を著しく低く抑えることができる. 最 終的に、FDTD 計算により得られた各層の吸収率が、 マトリクス法により得られた結果と非常によく一致す ることを確認した.

3. シミュレーション結果

提案する手法の有効性を検討するため,図1左に示 す P3HT/PCBM 型有機太陽電池に対し、典型的な反射 防止膜用材料である MgF2, ZnS, Al2O3の3 種類[18]を 使用した,6層(基板の両面に3層ずつ)の反射防止 膜の設計を行った.設計により得られた最適な反射防 止膜の構成を表 1(No.1)に、この最適解における波長毎 の吸収特性を図2,3に示す.図2には,比較のために, 反射防止無しの場合と,屈折率を直接最適化した場合 (表1最下段) も示している. 図 2,3 から, 太陽光の irradiance が弱い低波長域(300 ~450 nm)では, 反射防 止の有無に関わらず P3HT/PCBM によって光がよく吸 収できるのに対し、太陽光の irradiance が相対的に強 い高波長域(>450nm)では、波長と共に P3HT/PCBM に よる光吸収が徐々に低下する傾向にあり、特に P3HT の band gap に近い 650 nm 付近の領域では、Al による 強い吸収が起きて,太陽電池裏側での光反射を妨げて いることが分かる.

表 2 から容易に分かるように, 高波長域での P3HT/PCBM の屈折率の増加と消衰係数の減少が, こ の材料の入射側での反射を増加させると共に, 内部で の吸収を抑制するため,高波長域での吸収量の低下(図 2)の要因となっていると考えられる. さらに, 図 3 の ように,高波長域で Al による光吸収が起きる理由を検 討するため, P3HT/PCBM と Al 間の interface における 光透過を考える.一般に,屈折率 n₀,消衰係数 k₀の媒 質から屈折率 n₁,消衰係数 k₁の媒質へ光が伝搬する際 の透過率 T は,

$$T = \frac{4(n_1/n_0)(n_0^2 + k_0^2)}{(n_0 + n_1)^2 + (k_0 + k_1)^2}$$
(13)

で表される. $n_1 \ge k_1$ の値として,波長 $\lambda = 400, 500, 600, 又は700 nm における Al のデータ(表 2)を用いて,$ $T の値を屈折率 <math>n_0$ の関数としてプロットした結果を, 図 4 に示す. 但し図中, k_0 の値として,各波長での P3HT/PCBM の値を用いた場合(図 4 実線)と $k_0 = 0$ (図 4 点線)とした場合の2ケースをプロットした.

図 4 の結果は、高波長域での Al の特性 (高い n₁/k₁ 比)と P3HT/PCBM の高い屈折率 (大きな n₀)の相乗効 果により、P3HT/PCBM から Al への光の透過率が大幅 に増加することを示している. なお、高波長では、 P3HT/PCBM の消衰係数は十分小さく、透過率にはほ とんど影響しない(図 4 緑線). Al の強い吸収により、 P3HT/PCBM から Al に侵入した光は、全て Al 内部で 吸収されるため、図 4 の透過率の変化が、Al での高波 長域での光吸収(図 3)を誘発していると理解できる.

表1には、最適解(表1 No.1)に加えて、本設計法に より、最適解と同時に得られる準最適解(表 1 No.2-No.4)を示している.さらに、表には、これらの 解に対応した、膜厚誤差が無い場合とある場合の、反 射防止による短絡電流の増加率(それぞれ $\gamma \ge \tilde{\gamma}$)を 併記している.表から分かるように、No.2の解の J_{sc} の値は、最適値より約 0.1%だけ小さい(γ = +7.51 % (No.1)、+7.39% (No.2))のに対し、No.2の解の \tilde{J}_{sc} の値 は、最適解より約 0.2%大きい($\tilde{\gamma}$ = +6.97% (No.1)、 +7.17 % (No.2)). この結果は、最適解の代わりに準最 適解を利用した場合、誤差が無い場合の性能は僅かに 低下するが、製造時の膜厚誤差に対して、一定程度ロ バストになることを意味しており、実用的な反射防止 構造の設計を行う上で重要である.

さらに,表1のNo.2の解は,MgF₂とAl₂O₃の2種 類の材料のみを使用し,5層で構成されているのに対 し,No.1の解は3種類の材料を全て使用して6層で構 成されており,No.2の準最適解は,最適解に比較して 製造が容易である.このように,提案する方法では, 多くの準最適解を最適解と同時に得て,それらを比較 検討することで,膜厚誤差に対するロバスト性や,製 造プロセスにおける単純性を考慮した実用的な設計を 行うことが可能である.

さらに、太陽電池内部における反射防止層の位置の 影響を検討ため、材料の組み合わせ最適化と、屈折率 最適化のどちらかの手法を用いて、基板より入力側(図 1 左の L1-L3)に 3 層反射防止膜を導入した場合と、基 板より出力側(図 1 左の L4-L6)に 3 層反射防止膜を導



図 2 反射防止膜の導入による P3HT/PCBM の吸収エ ネルギーの変化.赤:材料の組合せ最適化により得ら れた反射防止膜を使用した場合.緑:屈折率最適化に より得られた反射防止膜を使用した場合.黒:反射防 止無しの場合.



図 3 材料の組合せを最適化した反射防止膜を導入した場合の太陽電池内部の吸収率の分布



図4 光がAlに侵入する場合の入射媒質の屈折率n0 に対する透過率の変化. 消衰係数 k₀の値は, P3HT/PCBMの値(実線)又は0(点線)を使用.

表 2 P3HT/PCBM と Al の光学パラメータ[14, 15]

波長	P3HT/PCBM		Al		
	n	k	n	k	
400 nm	1.90	0.54	0.40	4.45	
700 nm	2.72	0.11	1.55	7.00	

入した場合の比較を行った(図 5). 図より,どちらの最 適化法でも,基板より入力側に反射防止を行った場合 より,出力側に反射防止を行う方が,発電電流を向上 させる効果が高いこと,この性能向上効果の差は,屈 折率最適化を行った場合に顕著であることが分かる. 図 5 の結果は,nanoporous 材料のような屈折率を自由 に制御できる材料は,ガラス基板と ITO 間の間の屈折 率のずれに伴う反射を抑えるのに,特に有効であるこ とを示している.また,図 5 に示すように,基板の前 後の 3 層の反射防止膜の効果を単純に加えた場合(材 料組合せ最適化で 7.4 %,屈折率最適化で 10.3 %)に比 べて,6 層の反射防止膜を使用した場合(材料組合せ 最適化で 7.5 %,屈折率最適化で 10.5 %)は,0.1~0.2% 程度高い性能が得られており,2 箇所の反射防止膜の 特性を適合させることが重要であることが分かる.

4. 結論

本研究では,使用する材料をあらかじめ指定した場 合に,有機太陽電池の反射防止膜を決定するための, 実用的な設計手法を提案した.本手法により,基板の 前後に3層ずつ(計6層)の反射防止膜を設計した結果, MgF₂,ZnS,Al₂O₃の組合せで7.51%の発電電流増加が 見込めることを示した.また,本設計法では,最適解 のみならず,準最適解も検討の対象とすることで,膜 厚誤差に対してロバストな性能を有する解が得られる ことも示した.さらに,反射防止層の基板に対する相 対位置に依存した発電電流の増加効果を明らかにした.

文 献

[1] E. Bundgaard, F. C. Krebs, "Low band gap polymers for organic photovoltaics, "Solar Energy Materials & Solar Cells, 91, 954-985, 2007.

[2] W. C. Luk, K. M. Yeung, K. C. Tam, K. L. Ng, K. C. Kwok, C. Y. Kwong, A. M. c. Ng, "Enhanced conversion efficiency of polymeric photovoltaic cell by nanostructured antireflection coating," Organic Electronics, 12: 557-561, 2011.

[3] H. A. Macleod, "Thin-film optical filters," (fourth edition), CRC Press, New York, 2010.

[4] E. Osorio, R. Urteaga, L. N. Acquaroli, G. Garcia-Salgado, H. Juarez, R. R. Koropecki, "Optimization of porous silicon multilayer as antireflection coatins for solar cells, "Solar Energy Materials & Solar Cells, 95:3069-3073, 2011.

[5] D. J. Poxson, M. F. Schubert, F. W. Mont, E. F. Schubert, and J. K. Kim, "Broadband omnidirectional antireflection coatings optimized by genetic algorithm, "Optics Letters, 34: 728-730, 2009.

[6] W. Zhou, M. Tao, L. Chen, H. Yang, "Microstructured surface design for omnidirectional antireflection coatings," Journal of Applied Physics 102: 103105, 2007.

[7] J. Zhu, Z. Yu, S. Fan, Y. Cui, "Nanostructured photon management for high performance solar cells, Materials Science and Engineering, R 70: 330-340, 2010.



図 5 3層 ARC(L1-L3 又は L4-L6)と 6層 ARC による Jsc の増加率の比較

[8] A. H. G. R. Kan and G. T. Timmer, "Stochastic global optimization methods. Part I: Clustering methods," Mathematical Programming 39:27-56, 1987.

[9] M. Ghebrebrhan, P. Bermel, Y. Avniel, J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, "Global optimization of silicon photovoltaic cell front coatings," Optics Express, 17: 7505-7518, 2009.

[10] N-K. Persson and O. Inganas, "Simulations of optical processes in organic photovoltaic devices," In: S. S. Sun and N. S. Sariciftci, Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials, and Devices, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2005.

[11] N-K. Persson and O. Inganas, "Organic tandem solar cells-modeling and predictions," Solar Energy Materials & Solar Cells, 90: 3491-3507, 2006.

[12] A. Y. Darkwi, W. K. Lote, and K. Ibrahim, "Computer simulation of collection efficacy of a-Si : H tandem solar cells interconnected by transparent conductive oxide," Solar Energy Materials & Solar Cells 60, 1-9, 2000.

[13] A. Taflove, S. C. Hagness, "Computational Electrodynamics: The finite-difference time-domain method," (third edition) Artech house, inc. Norwood, 2005.

[14] E. Lioudakis, A. Othonos, I. Alexxandrou, Y. Hayashi, "Optical properties of conjugated poly(3-hexylthiophene)/[6,6]-phenylC₆₁-butyric acid methyl ester composites," Journal of Applied Physics, 102: 083104, 2007.

[15] D. E. Gray, American Institute of Physics Handbook (third edition), American Institute of Physics, McGraw-Hill Book Company, 1972.

[16] J. B. Judkins and R. W. Ziolkowski, "Finite-difference time-domain modeling of nonperfectly conducting metallic thin-film gratings," Journal of the Optical Society of America, 12: 1974-1983, 1995.

[17] J. Wang, C-W. Want, Y. Li, F. Zhou, W-M. Liu, "The structure optimization design of the organic solar cells using the FDTD method," Physica B, 405: 2061-2064, 2010.

[18] D. Bouhafs, A. Moussi, A. Chikouche, J. M. ruiz, "Design and simulation of antireflection coating systems for optoelectronic devices: Application to silicon solar cells," Solar Energy Materials and Solar Cells 52, 79093, 1998.